Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio de fuerza atómica de barrido por sonda B2-01-35-162-4510

Código: B2-01-35-162-4510

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

▶Capacidades superiores que lo simplifican todo

●La platina de muestras tiene gran capacidad de ampliación y es muy cómoda para combinar varios instrumentos y lograr detección in situ

●Barrido automático con un clic, con posibilidad de programar varios puntos de prueba para una detección rápida y automatizada

●La muestra permanece inmóvil durante el barrido de la imagen y la sonda se desplaza en forma tridimensional XYZ para obtener imágenes de medición

●Diseño de cabezal de barrido tipo pórtico, base de mármol, platina de adsorción por vacío

●Solución integrada de amortiguación de vibraciones mecánicas y blindaje contra ruido ambiental, que reduce considerablemente el nivel de ruido del sistema

▶Combinación perfecta de excelente experiencia y alta precisión

●Método inteligente y rápido de aproximación de la aguja, con detección automática de la cerámica piezoeléctrica bajo control de motor, que protege sondas y muestras

● Editor de usuario para la corrección no lineal del escáner, con caracterización nanométrica y exactitud de medición mejor que 98%

◆ El primer microscopio de fuerza atómica comercial de China que mantiene la muestra estacionaria mientras la sonda se mueve y barre;

◆ El tamaño y el peso de la muestra son casi ilimitados, lo que lo hace especialmente adecuado para detectar muestras muy grandes;

◆ La platina de muestras es altamente ampliable, lo que resulta muy conveniente para combinar varios instrumentos y realizar detección in situ;

◆ Control eléctrico de la mesa de desplazamiento y de la mesa elevadora de la muestra, programables con múltiples posiciones para lograr una detección automática rápida;

◆ Diseño de cabezal de barrido tipo pórtico, base de mármol, platina de adsorción por vacío y adsorción magnética;

◆ El motor controla automáticamente el método inteligente de aproximación de la aguja con detección automática de cerámica piezoeléctrica, para proteger la sonda y la muestra;

◆ Posicionamiento con microscopio óptico auxiliar de alto aumento, con observación y posicionamiento en tiempo real de la sonda y del área de barrido de la muestra;

◆ Editor de usuario integrado para la corrección no lineal del escáner; caracterización nanométrica y exactitud de medición mejor que 98%.

□	B2-01-35-162-4510

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modo de trabajo	Modo contacto Modo tapping Modo fricción Modo magnético Modo electrostático □Opcional□ Modo de fase
Curva de espectro de corriente	Curva RMS-Z Curva de fuerza F-Z
Modo de barrido XY	Barrido accionado por la sonda, escáner de tubo piezoeléctrico
Rango de barrido XY	70×70um
Resolución de barrido XY	0,2nm
Rango de barrido Z	5um
Resolución de barrido Z	0,05nm
Velocidad de barrido	0,6Hz~30Hz
Ángulo de barrido	0~360°
Peso de la muestra	≤15Kg
Tamaño de la platina	B2-01-35-162-4501-4 4’ 100mm B2-01-35-162-4501-6 6’ 150mm B2-01-35-162-4501-8 8’ 200mm B2-01-35-162-4501-12 12’ 300mm
Movimiento XY de la platina	Resolución 1um B2-01-35-162-4501-4 4’ 100x100mm B2-01-35-162-4501-6 6’ 150x150mm B2-01-35-162-4501-8 8’ 200x200mm B2-01-35-162-4501-12 12’ 300x300mm
Desplazamiento Z de la platina	15mm, resolución 10nm □Opcional□ 20mm 25mm
Diseño de amortiguación de impactos	Suspensión por resortes □Opcional□ Amortiguador activo
Sistema óptico	Objetivo 10x Cámara digital de 5,0M
Salida	USB2.0/3.0
Software	Win XP/7/8/10
Cuerpo principal	Cabezal de barrido tipo pórtico, base de mármol

□	Resolución	Condición de trabajo	Temperatura de trabajo	Daño a la muestra	Profundidad de inspección
SPM	Nivel atómico 0,1nm	Normal, líquido, vacío	Temperatura ambiente o baja	Ninguno	1~2 niveles atómicos
TEM	Punto 0,3~0,5nm Red cristalina 0,1~0,2nm	Alto vacío	Temperatura ambiente	Pequeño	Generalmente<100nm
SEM	6-10nm	Alto vacío	Temperatura ambiente	Pequeño	10mm @10x 1um @10000x

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

FIM	Nivel atómico 0,1nm	Ultra alto vacío	30~80K	Daño	Espesor atómico

Microscopio	Microscopio óptico	Microscopio electrónico	Microscopio de sonda de barrido
Resolución máxima (um)	0,18	0,00011	0,00008
Observación	Inmersión en aceite 1500x	Imágenes de átomos de carbono de diamante	Imágenes de átomos de carbono grafítico de alto orden

Interacción sonda-muestra	Señal de medición	Información
Fuerza	Fuerza electrostática	Forma
Corriente de túnel	Corriente	Forma, conductividad
Fuerza magnética	Fase	Estructura magnética
Fuerza electrostática	Fase	distribución de carga

Imágenes				
N.º de modelo	**B2-01-35-162-4510**			
Escala de enfoque	0,000000			
Rango de enfoque	0,000000			
Función estándar	BF+DF+PH+DIC			

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

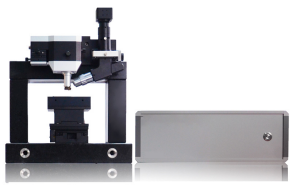


Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización